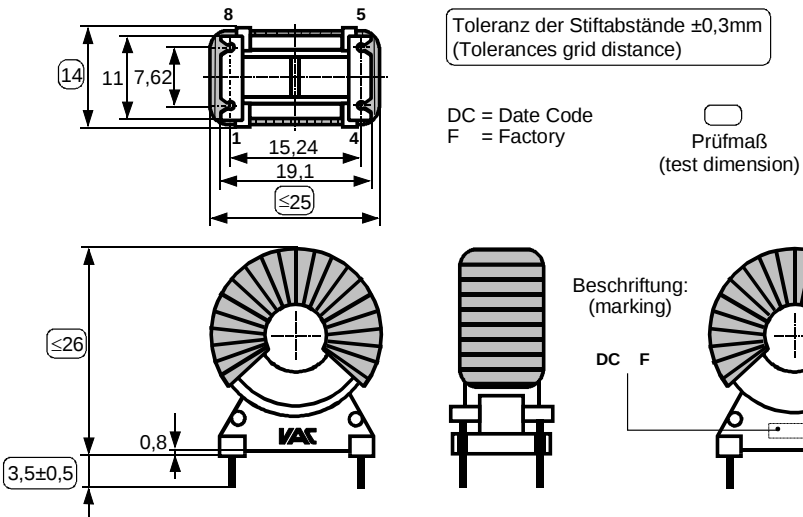
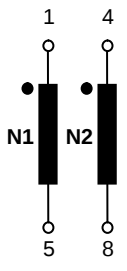


K-Nr.: K-no.:	Speicherdrossel / Storage Choke	Datum: 15.10.2012 Date:
Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 1 von 1 Page of

Maßbild (mm): Mechanical outline	Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c General tolerances	Anschlüsse: Connections: Cu-verz. Ø 0,71 mm cu-tinned
 Toleranz der Stiftabstände ±0,3mm (Tolerances grid distance) DC = Date Code F = Factory Prüfmaß (test dimension) Beschriftung: (marking) DC F		Beschriftung: marking  6161X002 DC F

Anschlußschema: Schematic diagram	Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte): Operational data/characteristic data (nominal values):
 ü = 1 : 1	$I_N = 2,5 \text{ A}$ $L = 140 \mu\text{H}$ (N1+N2 in Reihe/series) $I_N = 5,0 \text{ A}$ $L = 35 \mu\text{H}$ (N1+N2 parallel) $\Delta I = 0,2 \cdot I_N$ $f \leq 200 \text{ kHz}$ $\tau_{\max} \geq 0,25$ Umgebungstemperatur/ambient temperature: -40 °C ..+ 60 °C Lagertemperatur/storage temperature: -40 °C...+125 °C

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL....: DIN ISO 2859-Teil1; SC = significant characteristic)				
Inspection				
1)	(V)	M3014:	$U_{p,eff} = 0,5 \text{ kV}$,	2 s, N1 gegen/vs N2
2)	(V)	M3214:	$L = 140 \mu\text{H} + 25\% - 10\%$, $I_{DC} = 2,5 \text{ A}$, $f = 100 \text{ kHz}$,	$U_{AC,eff} = 250 \text{ mV}$ (SC) (N1+N2 in Reihe/series)
3)	(AQL 1/S4)	M3011/5:	$R_{Cu1} \leq 43 \text{ m}\Omega$;	$R_{Cu} \leq 43 \text{ m}\Omega$
4)	(Fix 05)	M3290:	Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 solderability test acc. to chapter 1	
Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur				
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature				

Weitere Vorschriften: Applicable documents:		Anschlußträger UL-gelistet Terminal UL-listed	
Datum	Name	Index	Änderung
15.10.12	Re.	80	Mechanical outline updated (test dimensions) and SC-value specified. CN-539
17.03.11	EI	80	DB standardize: lapidary change.
Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Lo. designer		KB-PM: check
			freig.: HS released